



## ТЕМА СЕМИНАРА

«Методы анализа тонких пленок и покрытий»

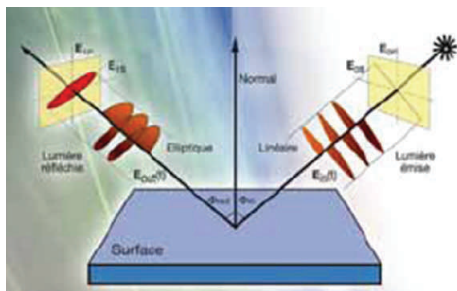
## ПРОГРАММА СЕМИНАРА

**9:30-10:30** Регистрация участников семинара

**10:30-10:50** Приветствие участников семинара.  
О компании Horiba Scientific

**10:50-11:50**

### Спектральная эллипсометрия



- Теоретические основы метода
- Эллипсометры компании Horiba Scientific

**11:50-12:50**

### Практическое применение метода



Примеры для анализа:

- полупроводниковых пленок
- многослойных структур
- оптических покрытий
- солнечных батарей

**Дата: 14/05/09**

**Время: 09:30 - 16:30**

Контактное лицо:  
Эльвира Аникина

eanikina@nytek.ru  
+7 (926) 7112534

**Адрес:**

Конференц-зал  
гостиницы «Восток»  
г. Москва, ул. Гостиничная  
д.9а корп. 3



**12:50-13:10**

**Кофе—брейк**

---

**13:10-14:00**

**Программное обеспечение**



Работа с программным обеспечением для обработки данных эллипсометрии

---

**14:00-15:00**

**Метод элементного анализа тонких пленок - спектроскопия тлеющего разряда**



**15:00-16:00**

**Кофе-брейк**